

V ВСЕУКРАЇНЬСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ У ЦАРИНІ МЕТРОЛОГІЇ “TECHNICAL USING OF MEASUREMENT-2019”

V ALL-UKRAINIAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS IN THE FIELD OF METROLOGY “TECHNICAL USING OF MEASUREMENT-2019”

Яцук В.О., д-р техн. наук, проф.,

Національний університет “Львівська політехніка”, Україна; e-mail: yatsuk.vasyl@gmail.com

Vasyl Yatsuk, Dr. Sc., Prof.,

Lviv Polytechnic National University, Ukraine; e-mail: yatsuk.vasyl@gmail.com

<https://doi.org/10.23939/istcm2019.01.075>

Анотація. Подано інформацію про V Всеукраїнську конференцію молодих вчених в царині метрології, яка відбулася 29 січня – 02 лютого 2019 року в Національному університеті “Львівська політехніка” (база “Політехнік-3” м. Славське). Конференцію провела кафедра інформаційно-вимірювальних технологій Львівської політехніки. Співорганізаторами конференції були: Академія метрології України, Національний університет “Львівська політехніка”, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (“Система”).

У роботі конференції взяли участь 84 українських та закордонних фахівців у галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю, серед них були науковці, інженери, аспіранти та студенти з 19 вищих закладів освіти, установ та підприємств різних регіонів України.

У резолюції конференції, зокрема, ухвалили використати її матеріали для покращення змісту відповідних навчальних програм, для формування тематики наукових досліджень, для зосередження уваги під час підготовки фахівців на практичних аспектах із активним використанням інформаційних технологій.

Ключові слова: Конференція молодих вчених, метрологія та метрологічне забезпечення, навчальні програми, практична підготовка.

Abstract. Information on the V Ukrainian conference of young scientists in the field of metrology, which took place on January 29 – February 2, 2019 at the Lviv Polytechnic National University (Polytechnic-3 base, Slavske) is provided. The Department of Information and Measurement Technologies of Lviv Polytechnic held the conference. Co-organizers of the conference were: the Academy of Metrology of Ukraine, the Lviv Polytechnic National University, the National Technical University of Ukraine “Kiev Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky”, state enterprise “Research Institute of Metrology of Measuring and Control Systems” (“System”).

84 Ukrainian and foreign experts in the field of metrology, standardization, certification and quality management participated in the conference. Among them were scientists, engineers, post-graduate students and students from 19 higher educational establishments, institutions and enterprises of different regions of Ukraine.

The resolution of the conference in particular decided using its materials to improve the content of the relevant curricula, to form the subject of scientific research, to emphasize the importance of training specialists in practical aspects.

Key words: Conference of young scientists, Metrology and metrological support, Tutorials, Practical training.

Інформація

29 січня – 2 лютого 2019 року в Національному університеті “Львівська політехніка” (база “Політехнік-3” м. Славське) відбулася Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології “Technical using of Measurement-2019”, яку організувала і провела кафедра інформаційно-вимірювальних технологій Львівської політехніки. Співорганізатори конференції: Академія метрології України, Національний університет “Львівська політехніка”, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (“Система”).

У роботі конференції взяли участь 84 українські та закордонні фахівці у галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю. Серед них науковці, інженери, аспіранти та студенти з 19 вищих навчальних закладів, установ та підприємств

різних регіонів України (Івано-Франківськ, Київ, Одеса, Суми, Харків, Опіле, Польща) (див. фото).

На урочистому відкритті конференції з вітальним словом виступив президент Академії метрології України професор Євген Володарський та директор Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології професор Микола Микійчук. На пленарних засіданнях виступили професор Н. Косач (ПАТ “ФЕД”), канд. техн. наук. А. Стеценко (ПрАТ “Енергооблік”), професори М. Микійчук, Н. Гоц (Національний університет “Львівська політехніка”), фахівці з ДП “НДІ “Система” В. В. Паракуда, О. В. Шпак, І. Г. Кізілівський, фахівці з ДП “Укрметртестстандарт” І. М. Потоцький та ДП “Івано-Франківськстандартметрологія” І. С. Петришин, О. А. Бас, Д. О. Середюк, професор Р. П. Мигущенко (Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”), професор В. І. Чигінь (Національна академія сухопутних військ України імені гетьмана П. Сагайдачного). Тематика пле-

нарних доповідей стосувалась наукових і практичних аспектів регулювання засобів забезпечення якості продукції, результатів досліджень ультразвукових лічильників, каліброваних на повітрі за атмосферного тиску та під час вимірювання витрати природного газу з високих тискаів, перспективи підготовки фахівців з метрології та інформаційно-вимірвальних технологій, напрямів міжнародної освітньої діяльності з метрології та інформаційно-вимірвальних технологій, результатів розроблення та випробувань еталонних устав для відтворення одиниці тиску в ультразвуковому діапазоні та потужності ультразвуку у водному середовищі, актуальних питань розроблення та експериментального дослідження методик перевірки засобів вимірювання об'єму та об'ємної витрати газу, теоретичних досліджень метрологічного забезпечення інформаційно-вимірвальних систем, результатів радіолокаційних досліджень для визначення характеристик безпілотних літальних апаратів.

Під час конференції також працювала школа-семинар на тему "Метрологічні вимоги за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017" під керівництвом доцента О. Малецької (Інститут підвищення кваліфікації метрологів Академії метрології України).

Стенові доповіді відобразили широку гаму питань, що стосувались виконання практичних вимі-

рювань та їх метрологічного підтвердження. Авторами стенових доповідей були 30 молодих вчених, докторантів, аспірантів та сім студентів, під час обговорень виникали жваві дискусії. Особливу увагу привернула доповідь курсанта П. Михайлишина (Національна академія сухопутних військ України імені гетьмана П. Сагайдачного) на тему "Вимірювання координат безпілотних літальних апаратів з використанням звукової та відеоапаратури".

Результати й обговорення

За результатами роботи конференції опубліковано збірник тез конференції, до якого увійшло 40 доповідей учасників, а також подано до друку в фахових журналах Львівської політехніки ("Вимірвальна техніка та метрологія") 12 статей.

Наукові доповіді, виступи й дискусії на конференції сприяли продуктивному обміну досвідом між вітчизняними досвідченими та молодими науковцями і практикаками в сфері метрологічної діяльності, зміцненню взаємозв'язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та забезпеченню обміну результатами досліджень за тематикою конференції, формуванню рекомендацій щодо вдосконалення метрології та метрологічного підтвердження і управління якістю в освіті та промисловості.



Загальне фото учасників V Всеукраїнської конференції молодих вчених в галузі метрології TUM-2019

The general photo of the participants of the All-Ukrainian conference of young scientists in the field of metrology TUM-2019

Висновки

У резолюції конференції, зокрема, ухвалили використати її матеріали для покращення змісту відповідних навчальних програм, для формування тематики наукових досліджень, для зосередження уваги під час підготовки фахівців на практичних аспектах із активним використанням інформаційних технологій. На круглому столі співголови конференції вручили сертифікати про участь у конференції усім її учасникам. Відбулось також засідання Академії метрології України.

Подяки

Автор та оргкомітет висловлюють вдячність колективу кафедри інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, Україна, за надану допомогу та всемірне сприяння у підготовці конференції. Велика вдячність також Академії метрології України, науковому та оргкомітету, усім учасникам конференції.

Конфлікт інтересів

Під час виконання роботи не існувало будь-яких фінансових, організаційних або інших можливих конфліктів, що стосуються цієї роботи.